3/7/1

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI

(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

015163913

WPI Acc No: 2003-224441/ 200322

Electrolyte film for fuel cell, has sulfone group component grafted to cross-linking fluororesin

Patent Assignee: HITACHI CABLE LTD (HITD)
Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week

JP 2002313364 A 20021025 JP 2001114951 A 20010413 200322 B

Priority Applications (No Type Date): JP 2001114951 A 20010413 Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes JP 2002313364 A 6 H01M-008/02

Abstract (Basic): JP 2002313364 A

NOVELTY - A sulfone group component is grafted to cross-linking fluororesin by irradiating an ionizing radiation at a temperature that is higher than melting point of resin to form a graft copolymer of fluororesin.

DETAILED DESCRIPTION - INDEPENDENT CLAIMS are also included for the following:

- (1) Electrolyte film manufacturing method; and
- (2) Fuel cell.

USE - For fuel cell (claimed).

ADVANTAGE - The film has sufficient mechanical strength and excellent ion-exchange property.

pp; 6 DwgNo 0/0

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-313364 (P2002-313364A)

(43)公開日 平成14年10月25日(2002.10.25)

(51) Int.Cl.7		識別記号		FΙ				·-マコード(参考)
H01M	8/02			H01M	8/02		P	4F073
C081	7/00	3 0 5 CEW		C08J	7/00		305 CEWZ	5 H O 2 6
	7/14 7/16	+.t.			7/14 7/16		02112	
	<u>. </u>		審査請求	未請求 請求	マダス で で で で で で で で で で で で で で で で で で で	OL	(全 6 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号

(22)出顧日

- 特願2001-114951(P2001-114951)

平成13年4月13日(2001.4.13)

(71)出願人 000005120

日立電線株式会社

東京都千代田区大手町一丁目6番1号

(72)発明者 山本 康彰

茨城県日立市日高町5丁目1番1号 日立

電線株式会社総合技術研究所内

(72)発明者 西 甫

茨城県日立市日高町5丁目1番1号 日立

電線株式会社総合技術研究所内

(74)代理人 100116171

弁理士 川澄 茂

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 燃料電池用電解質膜及びその製造方法並びに燃料電池

(57)【要約】

(修正有)

【課題】十分な機械的強度を有し、しかも、優れたイオン交換性を有する燃料電池用電解質膜及びこれを用いた燃料電池の提供。

【解決手段】樹脂の融点以上の温度で電離性放射線を照射して架橋させてなる架橋ふっ素樹脂に、スルホン基を有する成分がグラフトされている改質ふっ素樹脂からなる燃料電池用電解質膜。ふっ素樹脂はテトラフルオロエチレン系重合体テトラフルオロエチレンーパーフルオロ系共重合体およびテトラフルオロエチレンーへキサフルオロプロピレン系共重合体から選ばれる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】樹脂の融点以上の温度で電離性放射線を照射して架橋させてなる架橋ふっ素樹脂に、スルホン基を有する成分がグラフトされた改質ふっ素樹脂からなることを特徴とする燃料電池用電解質膜。

【請求項2】前記スルホン基を有する成分は、スルホン 基単独、スルホン化アルキル、スルホン化芳香族化合物 及びスルホン化含ふっ素化合物から選ばれる少なくとも 1種である請求項1記載の燃料電池用電解質膜。

【請求項3】前記改質ふっ素樹脂は、前記架橋ふっ素樹脂にスルホン基を有する化合物をグラフトしたものである請求項1記載の燃料電池用電解質膜。

【請求項4】前記改質ふっ素樹脂は、前記架橋ふっ素樹脂に有機化合物をグラフト後、当該グラフト体をスルホン化したものである請求項1記載の燃料電池用電解質膜。

【請求項5】前記有機化合物は、炭化ふっ素化合物、炭化水素化合物、芳香族化合物から選ばれる少なくとも1種である請求項4記載の燃料電池用電解質膜。

【請求項6】前記ふっ素樹脂は、テトラフルオロエチレン系重合体、テトラフルオロエチレンーパーフルオロ (アルキルビニルエーテル) 系共重合体及びテトラフルオロエチレンーへキサフルオロプロピレン系共重合体から選ばれる少なくとも1種である請求項1記載の燃料電池用電解質膜。

【請求項7】引張破断強度が10MPa以上で伸びが50%以上である請求項1記載の燃料電池用電解質膜。

【請求項8】ふっ素樹脂に、酸素濃度10torr以下の不活性ガス雰囲気下で、且つ当該ふっ素樹脂の融点以上に加熱された状態下で電離性放射線を照射線量0.1 kGy~10MGyの範囲で照射して架橋させて得た架橋ふっ素樹脂膜に、電離性放射線を照射線量10kGy~5MGy照射してスルホン基を有する化合物をグラフトすることを特徴とする燃料電池用電解質膜の製造方法。

【請求項9】ふっ素樹脂に、酸素濃度10torr以下の不活性ガス雰囲気下で、且つ当該ふっ素樹脂の融点以上に加熱された状態で電離性放射線を照射線量0.1kGy~10MGyの範囲で照射して架橋させて得た架橋ふっ素樹脂膜に、電離性放射線を照射線量10kGy~5MGy照射して有機化合物をグラフト後、当該グラフト体をスルホン化することを特徴とする燃料電池用電解質膜の製造方法。

【請求項10】樹脂の融点以上の温度で電離性放射線を 照射して架橋させてなる架橋ふっ素樹脂に、スルホン基 を有する成分がグラフトされた改質ふっ素樹脂からなる 電解質膜が、燃料極と空気極の間に設けられていること を特徴とする燃料電池。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、優れた機械的強度 を有する燃料電池用電解質膜及びその製造方法、並びに これを用いた高分子電解質型燃料電池に関するものであ る。

[0002]

【従来の技術】高分子電解質型燃料電池は、固体高分子よりなる電解質膜と、この電解質膜を挟むようにして設けられた燃料極と空気極とで構成されている。固体高分子よりなる電解質膜としては、例えば、パーフルオロスルホン酸ポリマからなるものが従来より知られている。【0003】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、パーフルオロスルホン酸ポリマからなる固体高分子電解質膜は、多工程に亘る重合過程を経て製造されるため高価であり、また、電池ユニット組立時や運転時の耐クリープ性が不十分であるため電圧低下やショート等を起こす可能性があり、信頼性の点で課題が残されている。

【0004】本発明の目的は、十分な機械的強度を有し、しかも、優れたイオン交換性を有する燃料電池用電解質膜及びこれを用いた燃料電池を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達 成するため、樹脂の融点以上の温度で電離性放射線を照 射して架橋させてなる架橋ふっ素樹脂に、スルホン基を 有する成分がグラフトされた改質ふっ素樹脂からなる燃 料電池用電解質膜を提供する。また、本発明は、前記燃 料電池用電解質膜の製造方法として、ふっ素樹脂に、酸 素濃度10torr以下の不活性ガス雰囲気下で、且つ 当該ふっ素樹脂の融点以上に加熱された状態下で電離性 放射線を照射線量0.1kGy~10MGyの範囲で照 射して架橋させて得た架橋ふっ素樹脂膜に、電離性放射 線を照射線量10kGy~5MGy照射してスルホン基 を有する化合物をグラフトさせる燃料電池用電解質膜の 製造方法、及びふっ素樹脂に、酸素濃度10torr以 下の不活性ガス雰囲気下で、且つ当該ふっ素樹脂の融点 以上に加熱された状態で電離性放射線を照射線量0.1 k G y~1 0 M G y の範囲で照射して架橋させて得た架 橋ふっ素樹脂膜に、電離性放射線を照射線量10kGy ~5MG y 照射して有機化合物をグラフト後、当該グラ フト体をスルホン化する燃料電池用電解質膜の製造方法 を提供する。更に、本発明は、樹脂の融点以上の温度で 電離性放射線を照射して架橋させてなる架橋ふっ素樹脂 に、スルホン基を有する成分がグラフトされた改質よっ 素樹脂からなる電解質膜が、燃料極と空気極の間に設け られている燃料電池を提供する。

【0006】このように、本発明の電解質膜は、照射架 橋架橋ふっ素樹脂にスルホン基を有する化合物を電離性 放射線の照射によりグラフトしたものであり、製造工程 が簡略化されることにより低価格化を図ることができ、 しかもふっ素樹脂成形体の機械的特性を損なうことなく イオン交換性を付与することができる。

[0007]

【発明の実施の形態】本発明に使用されるふっ素樹脂としては、前述したPTFE、PFA、FEPといったものをあげることができ、ふっ素樹脂成形体の形状は特に限定されるものではないが、シート状、フィルム状、ブロック状、繊維状のいずれでもよく、又、これら材料同士あるいはこれら材料と他の材料との積層体や複合体であってもよい。

【0008】上記PTFEの中には、パーフルオロ(アルキルビニルエーテル)、ヘキサフルオロプロピレン、(パーフルオロアルキル)エチレン、あるいはクロロトリフルオロエチレン等の共重合性モノマーに基づく重合単位を1モル%以下含有するものも含まれる。また、上記共重合体形式のふっ素樹脂の場合、その分子構造の中に少量の第3成分を含むことは有り得る。

【0009】本発明における架橋ふっ素樹脂は、ふっ素樹脂に酸素濃度10torr以下の不活性ガス雰囲気下で、且つふっ素樹脂の融点以上に加熱された状態で電離性放射線を照射線量0.1kGy~10MGyの範囲で照射することにより得ることができる。酸素濃度が10torrを越える雰囲気下では、十分な架橋効果を達成できず、又、電離性放射線の照射線量が0.1KGy未満では十分な架橋効果を達成できず、10MGyを越えると伸び等の著しい低下を招く。なお、架橋ふっ素樹脂成形体は、シート又はブロック等の形状のふっ素樹脂成形体に電離性放射線を照射して製造してもよく、又、電離性放射線を照射したふっ素樹脂粉末を圧縮成形等によりシート又はブロック等の形状に成形してもよい。

【0010】ふっ素樹脂を架橋するときの電離性放射線 としては、ア線、電子線、X線、中性子線、あるいは高 エネルギーイオン等が使用される。電離性放射線を照射 するに際しては、ふっ素樹脂をその結晶融点以上に加熱 しておく必要がある。例えばふっ素樹脂としてPTFE を使用する場合には、この材料の結晶融点である327 ℃よりも高い温度にふっ素樹脂を加熱した状態で電離性 放射線を照射する必要があり、また、PFAやFEPを 使用する場合には、前者が310℃、後者が275℃に 特定される融点よりも高い温度に加熱して照射する。ふ っ素樹脂をその融点以上に加熱することは、ふっ素樹脂 を構成する主鎖の分子運動を活発化させることになり、 その結果、分子間の架橋反応を効率良く促進させること が可能となる。但し、過度の加熱は、逆に分子主鎖の切 断と分解を招くようになるので、このような解重合現象 の発生を抑制する意味合いから、加熱温度はふっ素樹脂 の融点よりも10~30℃高い範囲内に抑えるべきであ る。

【0011】本発明の改質ふっ素樹脂は、上記のようにして得た照射架橋ふっ素樹脂の表面にスルホン基を有す

る化合物を電離性放射線の照射によりグラフトさせることにより得ることができる。放射線を用いるグラフト法には、ふっ素樹脂の主鎖ポリマーにあらかじめ放射線を照射してグラフトの起点となるラジカルを生成させた後、ふっ素樹脂をスルホン基を有する化合物と接触させる前照射法、スルホン基を有する化合物とふっ素樹脂の共存下に電離性放射線を照射する同時照射法とがあるが、本発明においてはいずれの方法をも採用できる。更に、本発明においては、架橋ふっ素樹脂の表面に炭化かっ素化合物、炭化水素化合物、芳香族化合物から選ばれる化合物を電離性放射線の照射によりグラフトして後、当該グラフト体をスルホン化する方法も採用できる。

【0012】電離性放射線としては、r線、電子線、X線、陽子線などの100keV以上の放射線やイオンであって、ふっ素樹脂中を10~100μm以上透過できるものをあげることができ、高エネルギーのプラズマなども用いることができる。電離性放射線の照射線量は10kGy~5MGyが好ましく、10kGy未満では官能基の特性が有効に作用する程度のグラフト反応効果が達成されにくい傾向にあり、5MGyを越えると伸び等の著しい低下を招く傾向にある。又、電離性放射線を照射するときの温度が高くなると、ラジカルの消滅が起こるので、照射時の温度は室温ないしそれ以下が好ましい。更に、電離性放射線の照射は、不活性ガス雰囲気で行ってもよく、又、酸素の存在下で行ってもよい。

【0013】架橋ふっ素樹脂にグラフト重合されるスルホン基を有する化合物としては、スルホン基単独、スルホン化スチレン、スルホン化ポリスチレン、スルホン化ベンゼン及びスルホン化ポリエーテルサルホンに代表されるスルホン化芳香族化合物、スルホン化含ふっ素エーテル、スルホン化含ふっ素ポリエーテル及びスルホン化含ふっ素エポキシドに代表されるスルホン化含ふっ素化合物、並びにスルホン化アルキル等が挙げられる。

【0014】本発明においては、架橋ふっ素樹脂にスルホン基を有する化合物をグラフト結合させてもよく、また、架橋ふっ素樹脂に有機化合物をグラフト結合させ、その後グラフト結合した化合物を例えばクロロスルホン酸を用いてスルホン化してもよい。後者の場合の有機化合物としては、芳香族化合物、炭化ふっ素化合物、炭化水素化合物があり、芳香族化合物としては、例えば、

【0015】 【化1】

【0016】 【化2】

$$+$$
 $so_2 - coo o + c$

【0017】を挙げることができ、炭化ふっ素化合物と しては、例えば、

 $CF_2 = CFOCF_2CF(CF_3)OCF_2CF_3$ $CF_2 = CFOCF_2CF(CF_3)OCF_2CF_3COO$

を挙げることができ、炭化水素化合物としては、例え ば、

 $CH_2 = C (CH_3) COOCH_3$

 $CH_2 = CHOCH_2CH(CH_3)O(CH_3)COOH$ を挙げることができる。

【0018】架橋ふっ素樹脂にグラフトする化合物は、 有機溶剤に溶解し、溶液として放射線グラフト反応に用 いることができる。この有機溶剤としては、有機化合物 を均一に溶解するが、ふっ素樹脂は溶解しない有機溶剤 が好ましく、例えば、アセトン、メチルエチルケトン等 のケトン類、酢酸エチル、酢酸ブチル等のエステル類、 メチルアルコール、エチルアルコール、プロピルアルコ ール、ブチルアルコール等のアルコール類、テトラヒド ロフラン、ジオキサン等のエーテル類、N,N-ジメチル ホルムアミド、N,N-ジメチルアセトアミド、ベンゼ ン、トルエン等の芳香族炭化水素、n-ヘプタン、シク ロヘキサン等の脂肪族ないし脂環族炭化水素、あるいは 混合溶媒が用いられる。これらのなかでも架橋ふっ素樹 脂を膨潤させるものが好ましい。

【0019】放射線グラフト後の架橋ふっ素樹脂に対し ては、必要に応じて有機溶剤、例えば、メタノール、エ タノール、プロピルアルコール等のアルコール類、アセ トン、メチルエチルケトン等のケトン類、ベンゼシ、ト ルエン等の芳香族炭化水素、あるいはこれらの混合物で 洗浄してもよい。

[0020]

【実施例】 [実施例1] 厚さ50μmのPTFEフィル ム2.1gに対して酸素濃度0.5torrの窒素(8 00torr)ガス雰囲気下、340°Cの加熱温度の もとで電子線 (加速電圧2MeV) を照射線量300k Gy照射し、架橋PTFEフィルムを得た。架橋前と架 橋後のPTFEフィルムの融点と結晶化温度を走査型示 差熱量計を用いて測定したところ、未架橋PTFEフィ ルムの融点は330°、結晶化温度は310°であった のに対し、架橋PTFEフィルムの融点は305℃、結 晶化温度は277℃であった。又、架橋PTFEフィル ムを電子スピン共鳴装置を用いて残存ラジカル量を測定 したところ、残存ラジカルは全く認められなかった。

【0021】次に、H型ガラス製アンプルの一方にスチ レン溶液100mlを入れ、真空中で凍結-融解を繰り 返して脱気した。一方、架橋PTFEフィルムの0.8

gを窒素ガス中、室温で500kGyの電子線 (加速電 圧2MeV、電流2.8mA)を照射した後、不活性ガ ス中でガラスアンプルのもう一方に入れ、10-3 tor r程度の真空にした。この後、スチレンを含む溶液を融 解して架橋PTFEフィルム側に移し、60℃で2時間 反応させた。反応後、アンプルを開放してPTFEフィ ルムを取り出し、ベンゼン、次いでアセトンで洗浄し、 滅圧乾燥した。PTFEフィルムの反応前後の重量差か ら求めたグラフト率は30%であった。このフィルムを 更にアセトン抽出を繰り返しても重量は変化しなかっ た。

【0022】グラフトした架橋PTFEフィルムを冷却 管付フラスコに入れ、クロロスルホン酸100ml中に 入れ、湯浴中で30分間加熱した。得られた架橋PTF Eフィルムの赤外線吸収スペクトルから、新たにスルホー ン酸基による吸収が認められた。このイオン交換膜の性 能は、電流密度が1.5A/cm²、40%NaOH水溶 液中での電気抵抗がO.05Ω・cm²であった。ま た、グラフト後の架橋PTFEフィルムの引張破断強度 は16MPa、伸びは150%であった。 耐クリープ試 験は、シートを10枚積層したサンプルに断面積1mm ²のプローブを用い、ASTMD621-64に準じ2 00℃で7.2MPaの圧力を24時間加え、その後、 解体し24時間後の永久変形率を測定して行った。その 永久変形率は2%であった。

[実施例2] 厚さ50μmのPTFEフィルム2.1g に対して実施例1と同様に電子線を照射して架橋PTF Eフィルムを得た。この架橋PTFEフィルムに、空気 中、常温で電子線を30kGy照射し、グラフトの前処 理を行った。

【0023】次に、H型ガラス製アンプルの一方にスチ レン溶液100mlを入れ、真空中で凍結-融解を繰り 返して脱気した。一方、上記のグラフトの前処理を行っ た架橋PTFEフィルムを窒素ガス中でガラスアンプル のもう一方に入れ、10-3 torr程度の真空にした。 この後、スチレンを含む溶液を融解して架橋PTFEフ ィルム側に移し、100℃で2時間反応させた。反応 後、アンプルを開放してPTFEフィルムを取り出し、 ベンゼン、次いでアセトンで洗浄し、減圧乾燥した。P TFEフィルムの反応前後の重量差から求めたグラフト 率は30%であった。このフィルムを更にアセトン抽出 を繰り返しても重量は変化しなかった。

【0024】グラフトした架橋PTFEフィルムを冷却 管付フラスコに入れ、クロロスルホン酸100m1中に 入れ、湯浴中で30分間加熱した。得られた架橋PTF Eフィルムの赤外線吸収スペクトルから、新たにスルホ ン基による吸収が認められた。このイオン交換膜の性能 は、電流密度が1.0A/c m²、40%NaOH水溶液 中での電気抵抗が0.10Ω·cm²であった。また、 グラフト後の架橋PTFEフィルムの引張破断強度は1

3MPa、伸びは200%であった。耐クリープ試験での永久変形率は2.5%であった。

[実施例3] 厚さ50μmのPTFEフィルム2.1g (大きさ約20cm×10cm)を酸素濃度0.5to rrの窒素(800torr)ガス雰囲気下、330° Cの加熱温度のもとで電子線(加速電圧2MeV)を照 射線量100kGy照射し、架橋PTFEフィルムを得 た。この架橋PTFEフィルムを、窒素ガス雰囲気中に おいて、50℃以上の温度で50時間以上加熱して、残 存ラジカルがほぼ完全に消滅したことを電子スピン共鳴 装置で確認した。

【0025】この架橋PTFEフィルムを実施例2と同様の方法でスチレンの代わりに $CF_2=CFOCF_2CF$ (CF_3) O(CF_2) ${}_2SO_2F$ を60 ${}_2$ でグラフトさせた。グラフト率は10%であった。これを25%NaOHに浸漬し、90 ${}_2$ で10時間保持した。その後、6NHに浸漬し、90 ${}_2$ でで10時間保持した。その後、6NHに1を用い、20 ${}_2$ で5時間浸漬してスルホン化を行った。このイオン交換膜の性能は、電流密度が1.0A/cm²、40%NaOH水溶液中での電気抵抗が0.12 ${}_2$ 0%であった。また、グラフト後の架橋PTFEフィルムの引張破断強度は16MPa、伸びは130%であった。耐クリープ試験での永久変形率は3.0%であった。

「実施例4] 厚さ50μmのPTFEフィルム2.1g (大きさ約20cm×10cm)を酸素濃度0.5to rrの窒素(800torr)ガス雰囲気下、330° Cの加熱温度のもとで電子線(加速電圧2MeV)を照 射線量100kGy照射し、架橋PTFEフィルムを得 た。この架橋PTFEフィルムを、窒素ガス雰囲気中に おいて、50℃以上の温度で50時間以上加熱して、残 存ラジカルがほぼ完全に消滅したことを電子スピン共鳴 装置で確認した。

【0026】この架橋PTFEフィルムを実施例2と同様の方法でスチレンの代わりに $CF_2=CFOCF_2CF$ (CF_3)O(CF_2) $_2SO_3$ Hを60Cでグラフトさせた。グラフト率は15%であった。このイオン交換膜の性能は、電流密度が1.8 A/cm^2 、40%NaOH水溶液中での電気抵抗が0.20 $\Omega\cdot cm^2$ であった。また、グラフト後の架橋PTFEフィルムの引張破断強度は15MPa、伸びは80%であった。耐クリープ試験での永久変形率は3.7%であった。

[実施例4] 厚さ50μmのPTFEフィルム2. 1g (大きさ約20cm×10cm) を酸素濃度0.5to rrの窒素(800torr) ガス雰囲気下、330° Cの加熱温度のもとで電子線(加速電圧2MeV)を照射線量100kGy照射し、架橋PTFEフィルムを得た。この架橋PTFEフィルムを、窒素ガス雰囲気中において、50℃以上の温度で50時間以上加熱して、残存ラジカルがほぼ完全に消滅したことを電子スピン共鳴装置で確認した。

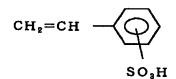
【0027】この架橋PTFEフィルムを実施例2と同様の方法でスチレンの代わりに $CF_2 = CFOCF_2CF$ (CF_3) $O(CF_2)_2SO_3Hを60$ ででグラフトさせた。グラフト率は15%であった。このイオン交換膜の性能は、電流密度が $1.8A/cm^2$ 、 $40\%NaOH水溶液中での電気抵抗が<math>0.20\Omega\cdot cm^2$ であった。また、グラフト後の架橋PTFEフィルムの引張破断強度は15MPa、伸びは80%であった。耐クリープ試験での永久変形率は3.7%であった。

[実施例5] 厚さ50μmのPTFEフィルム2.1g (大きさ約20cm×10cm)を酸素濃度0.5torrの窒素(800torr)ガス雰囲気下、330° Cの加熱温度のもとで電子線(加速電圧2MeV)を照射線量100kGy照射し、架橋PTFEフィルムを得た。この架橋PTFEフィルムを、窒素ガス雰囲気中において、50℃以上の温度で50時間以上加熱して、残存ラジカルがほぼ完全に消滅したことを電子スピン共鳴装置で確認した。

【0028】この架橋PTFEフィルムを実施例2と同様の方法でスチレンの代わりに

[0029]

【化3】



【0030】を60℃でグラフトさせた。グラフト率は20%であった。このイオン交換膜の性能は、電流密度が1.2A/cm²、40%NaOH水溶液中での電気抵抗が0.15 Ω ·cm²であった。また、グラフト後の架橋PTFEフィルムの引張破断強度は14MPa、伸びは60%であった。耐クリープ試験での永久変形率は4.5%であった。

[0031]

【発明の効果】以上説明してきた本発明によれば、十分な機械的強度を有し、しかも、優れたイオン交換性を有する燃料電池用電解質膜を実現できる。

!(6) 002-313364 (P2002-31JL8

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

HO1M 8/10

// CO8L 27:12

H01M 8/10 C08L 27:12

(72)発明者 浅野 健次

茨城県日立市日高町5丁目1番1号 日立

電線株式会社総合技術研究所内

Fターム(参考) 4F073 AA32 BA16 BB01 CA41 CA63

EA37 FA05

5H026 AA06 BB00 BB10 CX05 EE19

HH00 HH05 HH09